

適用於鋁電解電容的老化製程之檢查



- 搭載接觸檢知(CONTACT CHECK)功能
- 測定頻率: 120Hz
- 測定時間: 總和測定時間/約105msec.
(含接觸及殘留電壓檢知時間約27msec.+穩定時
45msec.)連續測定時約3回/秒
- 搭載數位比較器顯示, 輸出5分類判定
- 數據輸出:Centronics(標準)

Specifications

測定測定範圍及準確度(周圍溫度23°C±5°C)※D<1 串聯等價回路

測定檔位	400nF	4 μF	40 μF	400 μF	4mF	40mF
C準確度	±0.5%±2(digit)					1%±5(digit)
tan δ 準確度	± $\left(\frac{\tan \delta (\text{digit}) \times 0.3}{100} + 2 + \frac{2000}{C \times (\text{digit})}\right)$ digit					± $\left(\frac{\tan \delta (\text{digit})}{100} + 5 + \frac{2000}{C \times (\text{digit})}\right)$ digit
測定模式	串聯等價回路					

※tan δ 為100.0%~199.9%時, C與tan δ 的準確度為上述數據的2倍。

測定模式	串聯等價回路
測定信號數位準	400mV(r.m.s.)以下
測定方式	信號施印加二端點、信號檢出二端點、遮護端點構成五端點
測定頻率	120Hz±0.1%以內
測定端點	前面面板部:五端點 背面板部:8P圓型金屬連接口
接觸檢知	輸入端點有一個端點以上且約200Ω以上接觸電阻檢測出時,發出測定錯誤之功能
輸入保護	於四端點接觸,測定試料的未放電電壓檢測出約2.2V以上時,保護測定回路之功能 (殘留電壓檢知)
測定時間	[HOLD模式測定時間] 約105msec. (接觸檢知 & 殘留電壓檢知) 約27msec. (測定穩定時間) 約45msec. (至測定端點開放為止) 約96msec. [Free Running模式測定時間] 約3次/秒
比較器設定	容量C: LL、L、H、HH 4點“200~3999” 損失tan δ: “1~199.9”
比較器判定	數位數據比較方式
判定結果顯示	容量: CLO、CLG、CGO、CHG、CHI tan δ: DGO、DNG TOTAL: C/D-GO
判定結果外部輸出	GO1、GO2、CNG、DNG
控制信號	輸入: START、HOLD、RESET、CINH、SHIFT、NINH、GINH 輸出: GO1、GO2、CNG、DNG、CER、COV、DER、DOV、CEND、MEND、BUSY、SLCT、CCE、VCE、各種SHIFT判定
使用周圍環境	溫度: 5°C~+40°C、濕度: 80%以下(於水氣凝結狀態下不可使用)
電源需求	AC100V~240V切換、50/60Hz、約45VA
外觀尺寸	約432(W)×149(H)×450(D)mm (不包含橡膠墊等凸出物)
重量	約12kg

Remarks

※本製品為訂製商品

Option